

자기펄스 성형된 나노 구리의 중성자 소각 산란을 통한 기공 분석 Small-angle neutron scattering of pores in magnetic pulsed compacted nano-Cu

이근희, 이창규, 김홍희

한국원자력연구소, 대전광역시 유성구 덕진동 150 원자력 재료기술 개발팀

1. 서 론

나노 소재의 연구 개발이 활발해짐에 따라 금속 나노 분말의 응용에 관련한 연구가 절실히지고 있다. 금속 나노 분말의 경우 분말 자체로의 이용이 가능함과 동시에 적절한 성형법을 통해 별도로 성형한 후 나노구조를 갖는 재료로의 이용이 가능할 것으로 예상하고 있다. 이러한 나노 구조를 갖는 금속 성형체의 물리적 성질에 가장 큰 영향을 미치는 요인은 미세 구조로서 성형이후에도 지속적으로 나노 구조를 유지할 것인지와 어느정도의 기공도를 가지고 있는가이다. 본 연구에서는 분말의 동적성형법인 자기펄스 성형법(Magnetic pulsed compaction)¹⁾으로 나노 구리 분말을 일축 압축한 후 미세구조를 분석하고, 분말 성형체 내의 기공을 중성자 소각산란²⁾(Small angle neutron scattering)으로 분석하였다. 중성자 소각산란을 통하여 기공의 크기 및 분포를 분석할 수 있었으며, 이를 역으로 계산하여 성형체의 밀도를 구하였다. 이 결과를 아르키메데스 법으로 구한 상대밀도와 비교하여 나노 성형체의 중성자 소각산란을 통한 기공분석의 신뢰성을 시험하였다. 또한 이러한 분석을 통하여 자기 펄스 성형법의 나노 분말 성형에 관한 효용성을 검증하고자 하였다.

2. 실험방법

본 실험에서 사용한 자기펄스 압축장치는 펄스력(pulse force) 850kN, 인가 시간 300μs 이상, 축적에너지 30kJ, 인터 터 전압은 50kV 이상으로 사용 가능하다. 시편의 직경은 30mm 이상으로 제조 가능하며 본 연구에서는 직경 15mm의 디스크 시편을 제조하였다. 압축온도는 70, 300°C로 변화시켰으며, 압축력은 1.6GPa, 압축속도는 0.01m/s, 일정 압축전압 2.4kV pulse에서 압축하였다. 압축 후 다이와 시편을 가열로 안에서 냉각한 후 꺼내어 아르키메데스 법으로 밀도를 측정하였다. 이 후 0.05μm까지 미세 연마하고 H₂O₂+H₂O+NH₄OH 용액에서 약 10초간 에칭한 후 주사 전자현미경(SEM)으로 미세구조를 관찰하였다. 중성자 소각 산란 실험은 원자력연구소 하나로 연구동의 중성자 소각 산란 장치를 이용하였다. 파장 8.29 Å의 중성자를 약 2mm 두께의 시편에 2시간 동안 조사하고, 산란되는 중성자를 산란각에 따라 카운팅하여 산란강도를 얻은 후 이를 처리하여 기공의 크기 및 분포를 얻었다.

3. 실험결과

자기펄스 성형법을 통해 나노 구리 분말을 압축하는 경우, 압축 밀도는 70°C인 경우 91%, 300°C일 때 95%의 높은 상대밀도를 얻을 수 있었다. 또한 입자성장이 거의 일어나지 않고 미세한 구조를 유지하였다. 성형체의 내부에는 매우 미세한 기공들이 분포하였다. 아래의 그래프는 중성자 소각산란으로 얻은 산란 강도를 환산하여 성형체 내부에 존재하는 기공의 평균 크기 및 분포를 도시한 것이다. 70°C의 경우 평균 기공의 크기가 약 33.7 Å, 300°C에서 98.3 Å으로 온도 증가에 따라 기공의 크기가 약간 증가하였으나, 기공의 수는 각각 6.95×10^{-6} , 7.40×10^{-8} ($\text{cm} \cdot \text{Å}^3$)으로 온도 증가에 따라 급격하게 줄어들었음을 알 수 있었다. 이것은 온도 증가에 따라 압축 밀도가 증가하는 것과 잘 일치하는 결과였다.

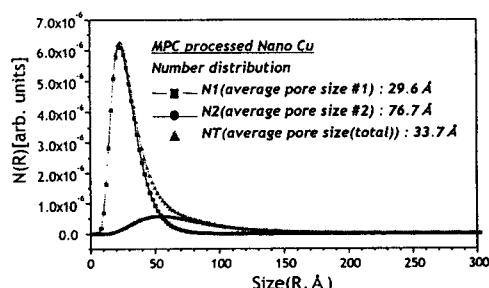


Fig.1 Pore size distributions in MPCed nano Cu at 70°C of compaction temperature.

4. 참고문헌

- (1) V.Ivanov, Y.A.Kotov, O.H.Samatov : Nanostructured Materials, 6(1995)2871
- (2) R.J.Roe : Methods of X-ray and Neutron scattering in polymer science, Oxford, Oxford university press (2000)